

蛍光X線分析の基礎と応用

【日時】 2019/9/19 (木) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部第2講義室 (西講義棟2階)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社島津製作所

13:00-15:00 蛍光X線分析の基礎

蛍光X線分析の原理、装置、定性分析、定量分析（検量線法、FP法）、分析結果の評価方法、試料前処理について説明します。

判断が困難な蛍光スペクトルの評価方法や、サンプル量がごく少量の場合の対処法についても解説します。

15:00-15:10 休憩

15:10-16:00 アプリケーションの紹介-薄膜・異物解析・微量分析-

蛍光X線分析は固体・粉末・液体・薄膜など、様々な形態の試料が分析可能です。殊に薄膜分析は元素の定量分析が可能であるのみならず、膜厚計算もできる非常に有用な手法です。ここでは蛍光X線分析の測定応用例について解説します。

16:00-17:00 EDXのFAQ

エネルギー分散型蛍光X線分析装置を使用する上で、よくある質問とその回答についてわかりやすく解説します。

今年度のセミナーは、学んだ機器分析の知識をより実践の場で活用できるような内容になっています。今回は、非破壊で元素分析が可能な蛍光X線分析に関して知識が得られる内容です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp